

УТВЕРЖДАЮ

Директор ФТИ им. А.Ф. Иоффе
д.ф.-м.н., проф.



С.В. Иванов

2021 г.

Средняя стоимость типовых исследований
Федерального Центра коллективного пользования
«Материаловедение и диагностика в передовых технологиях»
ФТИ им. А.Ф. Иоффе

№ п/п	Наименование диагностического метода	Цена, руб. в час	Средняя продолжительность измерения, час	Стоимость проведения измерения, руб.
1	Исследование параметров плазмы на УНУ «Глобус-М» в омическом разряде токамака	75 000	2	150 000
2	Исследование параметров плазмы на УНУ «Глобус-М» в разряде токамака с применением систем дополнительного нагрева и/или генерации безындукционного тока.	100 000	2	200 000
3	Рентгено-дифрактометрические исследования твердотельных веществ на высокоразрешающей рентгеновской станции Discover D8, Bruker	8 300	3	24 900
4	Рентгено-фазовые исследования материалов на порошковом рентгеновском дифрактометре D2 Phaser, Bruker	2 800	2	5 600
5	Исследования с помощью просвечивающей электронной микроскопии на JEM-2100F, Jeol	8 000	4	32 000
6	Проведение микроанализа на просвечивающем электронном микроскопе JEM-2100F, Jeol	8 800	2	17 600
7	Подготовка образцов для	4 000	4	16 000

	ПЭМ исследований			
8	Исследования с помощью растровой электронной микроскопии на JSM-7001F, Jeol	6 000	1	6 000
9	Проведение микроанализа на растровом электронном микроскопе JSM-7001F, Jeol	6 500	1	7 000
10	Проведение исследований дифракции обратного рассеяния электронов на растровом электронном микроскопе JSM-7001F, Jeol	7 000	2	14 000
11	Подготовка образцов для РЭМ исследований	4 000	1	4 000
12	Атомно-силовая микроскопия на сканирующем зондовом микроскопе Dimension 3100, Veeco	5 600	2	11 200
13	Исследования дефектов с глубокими уровнями в полупроводниковых гетероструктурах на установке нестационарной спектроскопии глубоких уровней (НСГУ - DLTS)	2 500	5	12 500
14	Исследования электрофизических свойств полупроводниковых гетероструктур на установке спектроскопии полной проводимости	2 500	5	12 500
15	Измерение температурной зависимости вольт-амперных и вольт-емкостных характеристик полупроводниковых приборов и гетероструктур	2 500	5	12 500
16	Исследования на вторично-ионном микроанализаторе Ion Microanalyzer IMS-7F, Cameca	12 500	5	62 500

Цены указаны без налога на добавленную стоимость. НДС взимается дополнительно по установленной законодательством Российской Федерации ставке.

Руководитель ЦКП



С.Г. Конников

Главный бухгалтер



О.М. Кулешова